

# 台阶仪

仪器基本信息			
仪器中文名	台阶仪		
仪器英文名	Profilometer		
仪器型号	DEKTAK XT		
生产厂家	德国 BRUKER		
工作状态	正常		
			
		主要技术指标	
		扫描长度范围	55mm (2 英寸)
		探针压力	1 至 15mg (LIS 3 传感器)
		高度重现性	$<5\text{\AA}$ , $1\sigma$ 在 $1\mu\text{m}$ 台阶上
		分辨率	垂直分辨率最大 $1\text{\AA}$ ( $6.55\mu\text{m}$ 垂直范围下)
样品台	X/Y 载物台手动 X-Y 平移: 100mm (4 英寸); 机动 X-Y 平移: 150mm (6 英寸);		
样品尺寸	最大样品厚度 50mm (2 英寸) 最大晶圆尺寸 200mm (8 英寸)		
主要配置与附件			
软件	软件 Vision64 操作及分析软件, 应力测量软件, 缝合软件, 三维扫描成像软件。		
功能用途及样品要求			
功能及特点	可用于测量轮廓、台阶高度、膜厚、薄膜应力, 表面粗糙度计算, 刻蚀分析, 用于控制各种薄膜的生长工艺, 各种符合尺寸的薄膜样品均可测试。物理、表面、材料、光电子器件、半导体器件、薄膜工艺、厚膜工艺、光学元件及系统的必备表征方法。		
测品要求	薄膜 (台阶), 台阶高度 50nm~mm 级		
联系方式			
仪器安放地点	深圳西丽大学城北大园区 G 栋 106		
仪器负责人	赵柏林		
联系电话	13277969369		
Email	zhaobolin@pku.edu.cn		
仪器预约与收费标准			
预约说明	接受校内 <a href="#">预约</a> , 校外预约请直接联系仪器负责人		
收费说明	见 <a href="#">收费标准</a>		